



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107680522 A

(43)申请公布日 2018.02.09

(21)申请号 201710929743.0

(22)申请日 2017.09.30

(71)申请人 京东方科技集团股份有限公司
地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号

(72)发明人 王伶俐

(74)专利代理机构 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262

代理人 胡艳华 李丹

(51)Int.Cl.
G09G 3/00(2006.01)

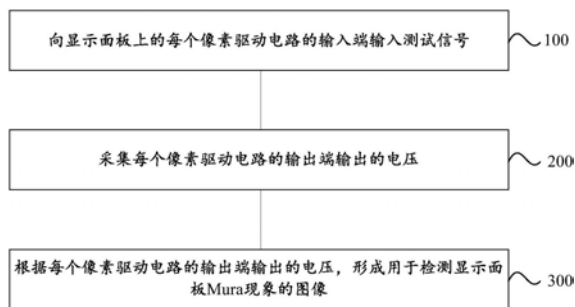
权利要求书2页 说明书7页 附图3页

(54)发明名称

一种显示面板检测方法及其装置

(57)摘要

本发明实施例提供一种显示面板检测方法及其装置,其中,该显示面板检测方法包括:向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压;根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像,本发明的技术方案通过对每个像素驱动电路输入测试信号,根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成图像来检测显示面板Mura现象,能够检测未进行OLED器件制作的显示面板是否存在Mura现象,并将阈值电压漂移不均匀的显示面板排除,节约了制作成本。



1. 一种显示面板检测方法,其特征在于,包括:
向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;
采集所述每个像素驱动电路的输出端输出的电压;
根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个像素驱动电路的输入端包括:数据信号端、扫描信号端和可变电压端;
则所述向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号,包括:
在第一阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电压端输入第一信号;
在第二阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电压端输入第二信号。
3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一信号的电压小于所述第二信号的电压。
4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每个像素驱动电路的输出端输出的电压为每个像素驱动电路中的数据信号端的输入信号的电压与驱动晶体管的阈值电压的差值。
5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像包括:
将每个像素驱动电路的输出端输出的电压转换成对应的亮度信号;
将每个像素驱动电路对应的亮度信号显示在每个像素驱动电路在显示面板相同的像素位置处,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。
6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所有像素驱动电路的对应的亮度信号,计算亮度均值;
判断每个像素驱动电路对应的亮度信号与所述亮度均值之差是否小于预设误差,在像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差大于预设误差的状态下,所述像素驱动电路对应的像素亮度显示异常。
7. 一种显示面板检测装置,其特征在于,包括:测试模块、采集模块和处理模块;
所述测试模块,与显示面板上的每个像素驱动电路的输入端连接,被配置为向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;
所述采集模块,与每个像素驱动电路的输出端连接,被配置为采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压;
所述处理模块,被配置为根据每个像素驱动电路的输出电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。
8. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,每个像素驱动电路的输入端包括:数据信号端、扫描信号端和可变电压端;
则所述测试模块被配置为:
在第一阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电压端输入第一信号;

在第二阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电压端输入第二信号。

9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述处理模块包括:转换单元和显示单元;

所述转换单元,被配置为将每个像素驱动电路的输出端输出的电压转换成对应的亮度信号;

所述显示单元,被配置为将每个像素驱动电路对应的亮度信号显示在每个像素驱动电路在显示面板相同的像素位置处,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述处理模块还包括:计算单元和判断单元;

所述计算单元,被配置为根据所有像素驱动电路的对应的亮度信号,计算亮度均值;

所述判断单元,被配置为判断每个像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差是否小于预设误差,在像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差大于预设误差的状态下,所述像素驱动电路对应的像素亮度显示异常。

一种显示面板检测方法及其装置

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板检测方法及其装置。

背景技术

[0002] 有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,简称AMOLED)显示器是当今显示器研究领域的热点之一。与液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)相比,有机发光二极管OLED显示器具有低能耗、生产成本低、自发光、宽视角及响应速度快等优点。

[0003] 目前,AMOLED显示面板可以利用氧化物(Oxide)的薄膜晶体管(TFT)工艺技术来制作。一般来说,采用氧化物的薄膜晶体管工艺技术所制作出来的AMOLED显示面板,其像素驱动电路中的薄膜晶体管的型态可以为P型或N型,但无论是选择P型还是N型薄膜晶体管来实现像素驱动电路,有机发光二极管的电流均会随着驱动晶体管的阈值电压偏移有所变化,使得AMOLED显示面板产生显示亮度不均匀Mura现象,进而影响AMOLED显示面板的亮度均匀性与亮度恒定性。

[0004] 经发明人研究发现,现有技术中需要通过人为观察显示面板上的OLED的发光情况才能检测到显示面板是否存在Mura现象,若未进行OLED器件制作的显示面板存在阈值电压偏移不均匀现象,此时在其上制作OLED器件的显示面板就会无法使用,造成了制作成本的浪费。

发明内容

[0005] 为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种显示面板检测方法及其装置,能够检测未进行OLED器件制作的显示面板是否存在Mura现象,并将阈值电压漂移不均匀的显示面板排除,节约了制作成本。

[0006] 为了达到本发明目的,本发明实施例提供了一种显示面板检测方法,包括:

[0007] 向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;

[0008] 采集所述每个像素驱动电路的输出端输出的电压;

[0009] 根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0010] 可选地,每个像素驱动电路的输入端包括:数据信号端、扫描信号端和可变电压端;

[0011] 则所述向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号,包括:

[0012] 在第一阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电压端输入第一信号;

[0013] 在第二阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电压端输入第二信号。

[0014] 可选地,所述第一信号的电压小于所述第二信号的电压。

[0015] 可选地,所述每个像素驱动电路的输出端输出的电压为每个像素驱动电路中的数据信号端的输入信号的电压与驱动晶体管的阈值电压的差值。

[0016] 可选地,所述根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像包括:

[0017] 将每个像素驱动电路的输出端输出的电压转换成对应的亮度信号;

[0018] 将每个像素驱动电路对应的亮度信号显示在每个像素驱动电路在显示面板相同的像素位置处,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0019] 可选地,所述方法还包括:

[0020] 根据所有像素驱动电路的对应的亮度信号,计算亮度均值;

[0021] 判断每个像素驱动电路对应的亮度信号与所述亮度均值之差是否小于预设误差,在像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差大于预设误差的状态下,所述像素驱动电路对应的像素亮度显示异常。

[0022] 在另一方面,本发明实施例还提供一种显示面板检测装置,包括:测试模块、采集模块和处理模块;

[0023] 所述测试模块,与显示面板上的每个像素驱动电路的输入端连接,被配置为向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;

[0024] 所述采集模块,与每个像素驱动电路的输出端连接,被配置为采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压;

[0025] 所述处理模块,被配置为根据每个像素驱动电路的输出电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0026] 可选地,每个像素驱动电路的输入端包括:数据信号端、扫描信号端和可变电电压端;

[0027] 则所述测试模块被配置为:

[0028] 在第一阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电电压端输入第一信号;

[0029] 在第二阶段,向所述数据信号端和所述扫描信号端输入高电平信号,向所述可变电电压端输入第二信号。

[0030] 可选地,所述处理模块包括:转换单元和显示单元;

[0031] 所述转换单元,被配置为将每个像素驱动电路的输出端输出的电压转换成对应的亮度信号;

[0032] 所述显示单元,被配置为将每个像素驱动电路对应的亮度信号显示在每个像素驱动电路在显示面板相同的像素位置处,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0033] 可选地,所述处理模块还包括:计算单元和判断单元;

[0034] 所述计算单元,被配置为根据所有像素驱动电路的对应的亮度信号,计算亮度均值;

[0035] 所述判断单元,被配置为判断每个像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差是否小于预设误差,在像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差大于预设误差的状态下,所述像素驱动电路对应的像素亮度显示异常。

[0036] 本发明实施例提供一种显示面板检测方法及其装置,其中,该显示面板检测方法

包括:向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;采集所述每个像素驱动电路的输出端输出的电压;根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像,本发明的技术方案通过对每个像素驱动电路输入测试信号,根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成图像来检测显示面板Mura现象,避免了现有技术中只能通过观察显示面板上的OLED才能发现Mura现象所造成的制作成本的浪费,能够检测未进行OLED器件制作的显示面板是否存在Mura现象,并将阈值电压漂移不均匀的显示面板排除,节约了制作成本。

[0037] 当然,实施本发明的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书实施例中阐述,并且,部分地从说明书实施例中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明实施例的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0038] 附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。

[0039] 图1为本发明实施例提供的显示面板检测方法的流程图;

[0040] 图2为本发明实施例提供的像素驱动电路的等效电路图;

[0041] 图3为本发明实施例提供的像素驱动电路的测试时序图;

[0042] 图4为本发明实施例提供的显示面板检测装置的一个结构示意图;

[0043] 图5为本发明实施例提供的显示面板检测装置的另一结构示意图。

具体实施方式

[0044] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。

[0045] 本领域技术人员可以理解,本申请所有实施例中采用的开关晶体管和驱动晶体管均可以为薄膜晶体管或场效应管或其他特性相同的器件。优选地,本发明实施例中使用的薄膜晶体管可以是氧化物半导体晶体管。由于这里采用的开关晶体管的源极、漏极是对称的,所以其源极、漏极可以互换。在本发明实施例中,为区分晶体管除栅极之外的两极,将其中一个电极称为第一极,另一电极称为第二极,第一极可以为源极或者漏极,第二极可以为漏极或源极。

[0046] 除非另外定义,本发明实施例公开使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明实施例中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语一直出该词前面的元件或误检涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者误检。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述的对象的位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

[0047] 为解决现有技术中只有在存在阈值电压偏移的AMOLED显示面板上安装OLED之后,才能发现Mura现象,但此时的显示面板已经无法使用,造成了制作成本的浪费的技术问题,本发明实施例提供了一种显示面板检测方法及其装置。

[0048] 实施例一

[0049] 图1为本发明实施例提供的显示面板检测方法的流程图,如图1所示,本发明实施例提供的显示面板检测方法,具体包括以下步骤:

[0050] 步骤100、向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号。

[0051] 具体的,向像素驱动电路的输入端输入的测试信号需要保证像素驱动电路输出的电压与像素驱动电路中的驱动晶体管的阈值电压有关。

[0052] 步骤200、采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压。

[0053] 需要说明的是,每个像素驱动电路中的驱动晶体管在使用一定时间后阈值电压均会发生漂移的程度有大有小,因此,每个像素驱动电路的输出端输出的电压也不尽相同。

[0054] 步骤300、根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0055] 在本实施例中,形成用于检测显示面板Mura现象的图像之后,可以通过相机拍摄一相片,人眼观察相片上各个像素的亮度是否均匀,或者通过一个处理器来对图像进行处理依次来判断显示面板是否存在Mura现象,若问题较为严重,则该显示面板排除,本发明对此不作任何限定。

[0056] 需要说明的是,人眼观察图像的亮度变化,或者通过一个处理器来对图像进行处理的标准是只要形成的图像亮度均一则说明该显示面板不存在Mura现象,即若显示面板上像素驱动电路中的驱动晶体管的阈值电压均发生漂移,但漂移的程度大致相同,图像的亮度整体偏亮或者整体偏暗,则说明显示面板不存在Mura现象。

[0057] 本发明实施例提供的显示面板检测方法包括:向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号;采集所述每个像素驱动电路的输出端输出的电压;根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像,本发明的技术方案通过对每个像素驱动电路输入测试信号,根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成图像来检测显示面板Mura现象,避免了现有技术中只能通过观察显示面板上的OLED才能发现Mura现象所造成的制作成本的浪费,能够检测未进行OLED器件制作的显示面板是否存在Mura现象,并将阈值电压漂移不均匀的显示面板排除,节约了制作成本。

[0058] 可选地,图2为本发明实施例提供的像素驱动电路的等效电路图,如图2所示,像素驱动电路的输入端包括:数据信号端Data、扫描信号端Scan和可变电压端VDD。

[0059] 可选地,步骤100包括:

[0060] 在第一阶段,向数据信号端Data和扫描信号端Scan输入高电平信号,向可变电压端VDD输入第一信号;在第二阶段,向数据信号端Data和扫描信号端Scan输入高电平信号,向可变电压端VDD输入第二信号。

[0061] 需要说明的是,第一阶段和第二阶段中的数据信号端Data输入的高电平信号的电压可以相同,也可以不同,第一阶段和第二阶段中的扫描信号端Scan输入的高电平信号的电压可以相同,也可以不同,本发明对此不作任何限定。

[0062] 可选地,第一信号的电压小于0V,可以为-5V等,第二信号的电压大于第一信号的

电压。

[0063] 另外,如图2所示,像素驱动电路还包括:开关晶体管T、驱动晶体管DTFT和电容C。

[0064] 具体的,开关晶体管T,与数据信号端Data、扫描信号端Scan和第一节点N1连接,用于在扫描信号端Scan的控制下,向第一节点N1提供数据信号端Data的信号。

[0065] 具体的,开关晶体管T的栅极与扫描信号端Scan连接,第一极与数据信号端Data连接,第二极与第一节点N1连接。

[0066] 驱动晶体管DTFT,与可变电压端VDD、第一节点N1和第二节点N2连接,用于在第一节点N1和可变电压端VDD的控制下,将第二节点N2的电压上拉至数据信号端Data的输入信号的电压Vref与驱动晶体管DTFT的阈值电压Vth的差值。

[0067] 具体的,驱动晶体管DTFT的栅极与第一节点N1连接,第一极与可变电压端VDD连接,第二极与第二节点N2连接。

[0068] 电容C,与第一节点N1和第二节点N2连接,用于存储第一节点N1和第二节点N2之间的电压。

[0069] 具体的,电容C的一端与第一节点N1连接,另一端与第二节点N2连接。

[0070] 需要说明的是,像素驱动电路中的第二节点N2即为像素驱动电路的输出端,由于第二节点N2的电压为数据信号端Data的输入信号的电压与驱动晶体管的阈值电压Vth的差值,因此,第二节点的电压能够体现出驱动晶体管DTFT的阈值电压。

[0071] 下面结合像素驱动电路的工作过程进一步说明本发明实施例的技术方案。

[0072] 图3为本发明实施例提供的像素驱动电路的测试时序图;如图2和3所示,本发明实施例提供的像素驱动电路包括:1个开关晶体管(T),1个驱动晶体管(DTFT)、1个电容单元(C),3个输入端(Data、VDD和Scan),其工作过程包括:

[0073] 第一阶段S1,扫描信号端Scan的输入信号为高电平,数据信号端Data的输入信号为高电平Vref,可变电压端VDD的输入信号为第一信号。

[0074] 由于扫描信号端Scan的输入信号为高电平,则开关晶体管T导通,数据信号端Data提供的输入信号的电压Vref与第二节点N2之间的差值大于驱动晶体管DTFT阈值电压Vth,此时,第一节点N1的电压为Vref,驱动晶体管DTFT导通,由于此时可变电压端VDD的输入信号为第一信号,即为低电平,此时,第二节点N2的电压被拉低至第一信号的电压。

[0075] 第二阶段S2,扫描信号端Scan的输入信号持续为高电平,数据信号端Data的输入信号持续为高电平Vref,可变电压端VDD的输入信号跳变为第二信号。

[0076] 由于扫描信号端Scan的输入信号持续为高电平,则开关晶体管T仍然导通,数据信号端Data提供的输入信号的电压Vref与第二节点N2之间的差值大于驱动晶体管DTFT阈值电压Vth,此时,第一节点N1的电压为Vref,驱动晶体管DTFT导通,由于可变电压端VDD的输入信号跳变为第二信号,变为了高电平,此时,可变电压端VDD开拉高第二节点N2的电压,直至第二节点N2的电压等于Vref-Vth,此时驱动晶体管DTFT关闭,这样电容C两端存储的电压为驱动晶体管DTFT的阈值电压Vth。

[0077] 由于像素驱动电路的输出端输出的电压即为第二节点N2的电压,而此时第二节点N2的电压为Vref-Vth,因此,像素驱动电路的输出的电压能够体现出驱动晶体管DTFT的阈值电压。

[0078] 可选地,步骤200包括:将每个像素驱动电路的输出端输出的电压转换成对应的亮

度信号;将每个像素驱动电路对应的亮度信号显示在每个像素驱动电路在显示面板相同的像素位置处,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0079] 需要说明的是,本实施例中显示每个像素驱动电路对应的亮度信号的装置需要与显示面板结构大致相同,即包括的像素个数以及像素的位置等。

[0080] 可选地,本发明实施例提供的显示面板检测方法还包括:根据所有像素驱动电路的对应的亮度信号,计算亮度均值;判断每个像素驱动电路对应的亮度信号与所述亮度均值之差是否小于预设误差,在像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差大于预设误差的状态下,像素驱动电路对应的像素亮度显示异常。

[0081] 实施例二

[0082] 基于上述实施例的发明构思,图4为本发明实施例提供的显示面板检测装置的一个结构示意图,如图4所示,本发明实施例提供的显示面板检测装置,应用实施例一提供的显示面板检测方法,具体包括:测试模块10、采集模块20和处理模块30。

[0083] 测试模块10,与显示面板上的每个像素驱动电路的输入端连接,被配置为向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号。

[0084] 具体的,向像素驱动电路的输入端输入的测试信号需要保证像素驱动电路输出的电压与像素驱动电路中的驱动晶体管的阈值电压有关。

[0085] 采集模块20,与每个像素驱动电路的输出端连接,被配置为采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压。

[0086] 需要说明的是,每个像素驱动电路中的驱动晶体管在使用一定时间后阈值电压均会发生漂移的程度有大有小,因此,每个像素驱动电路的输出端输出的电压也不尽相同。

[0087] 处理模块30,被配置为根据每个像素驱动电路的输出电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0088] 在本实施例中,形成用于检测显示面板Mura现象的图像之后,可以通过相机拍摄一相片,人眼观察相片上各个像素的亮度变化,或者通过一个处理器来对图像进行处理依次来判断显示面板是否存在Mura现象,若问题较为严重,则该显示面板排除,本发明对此不作任何限定。

[0089] 本发明实施例提供的显示面板检测装置,包括:测试模块、采集模块和处理模块,测试模块,与显示面板上的每个像素驱动电路的输入端连接,被配置为向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号,采集模块,与每个像素驱动电路的输出端连接,被配置为采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压,处理模块,被配置为根据每个像素驱动电路的输出电压,形成用于检测显示面板Mura现象的图像,本发明的技术方案通过对每个像素驱动电路输入测试信号,根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压,形成图像来检测显示面板Mura现象,避免了现有技术中只能通过观察显示面板上的OLED才能发现Mura现象所造成的制作成本的浪费,能够检测未进行OLED器件制作的显示面板是否存在Mura现象,并将阈值电压漂移不均匀的显示面板排除,节约了制作成本。

[0090] 可选地,像素驱动电路的输入端包括:数据信号端、扫描信号端和可变电电压端。

[0091] 则测试模块10被配置为:在第一阶段,向数据信号端和扫描信号端输入高电平信号,向可变电电压端输入第一信号;在第二阶段,向数据信号端和扫描信号端输入高电平信号,向可变电电压端输入第二信号。

[0092] 可选地,图5为本发明实施例提供的显示面板检测装置的另一结构示意图,如图5所示,处理模块30包括:转换单元31和显示单元32。

[0093] 转换单元31,被配置为将每个像素驱动电路的输出端输出的电压转换成对应的亮度信号。

[0094] 显示单元32,被配置为将每个像素驱动电路对应的亮度信号显示在每个像素驱动电路在显示面板相同的像素位置处,形成用于检测显示面板Mura现象的图像。

[0095] 可选地,处理模块还包括:计算单元和判断单元。

[0096] 计算单元,被配置为根据所有像素驱动电路的对应的亮度信号,计算亮度均值;

[0097] 判断单元,被配置为判断每个像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差是否小于预设误差,在像素驱动电路对应的亮度信号与亮度均值之差大于预设误差的状态下,像素驱动电路对应的像素亮度显示异常。

[0098] 有以下几点需要说明:

[0099] 本发明实施例附图只涉及本发明实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计。

[0100] 在不冲突的情况下,本发明的实施例即实施例中的特征可以相互组合以得到新的实施例。

[0101] 虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

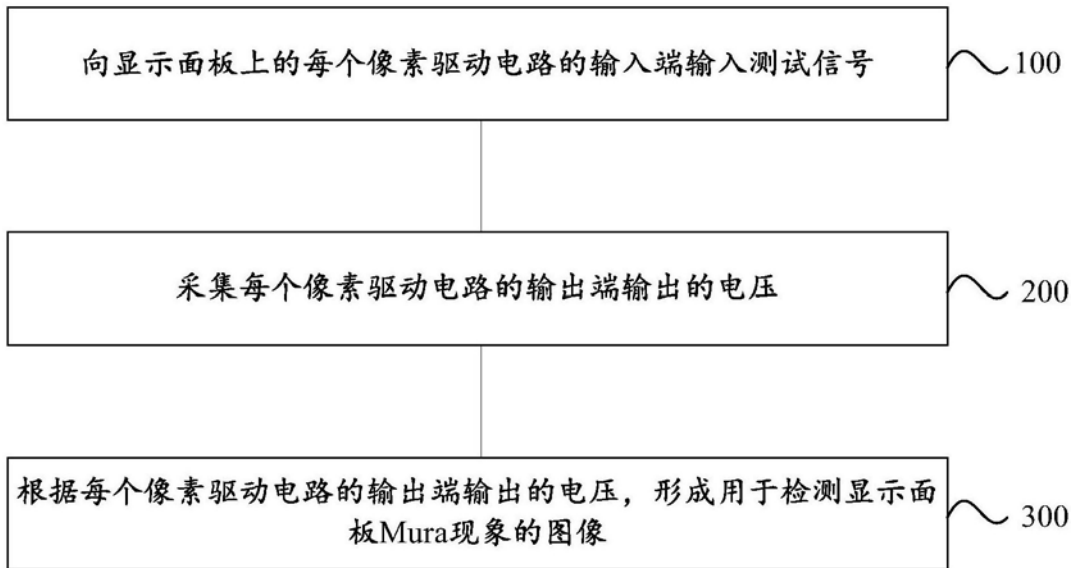


图1

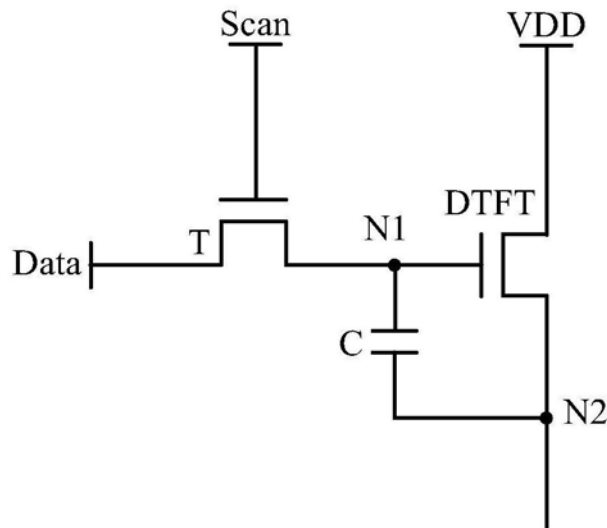


图2

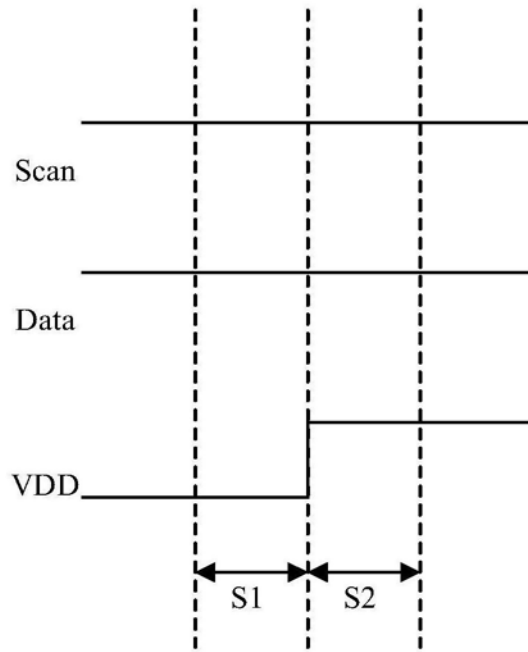


图3

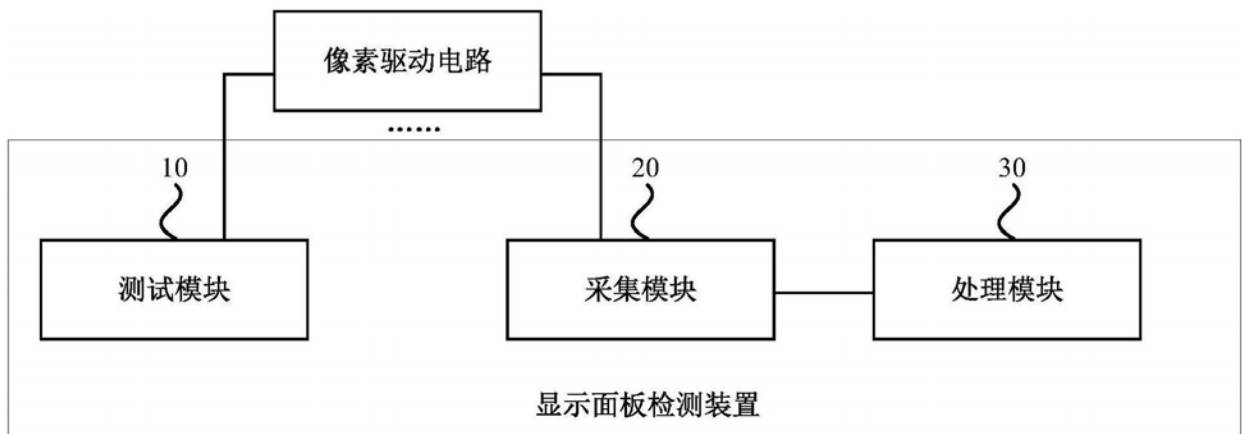


图4

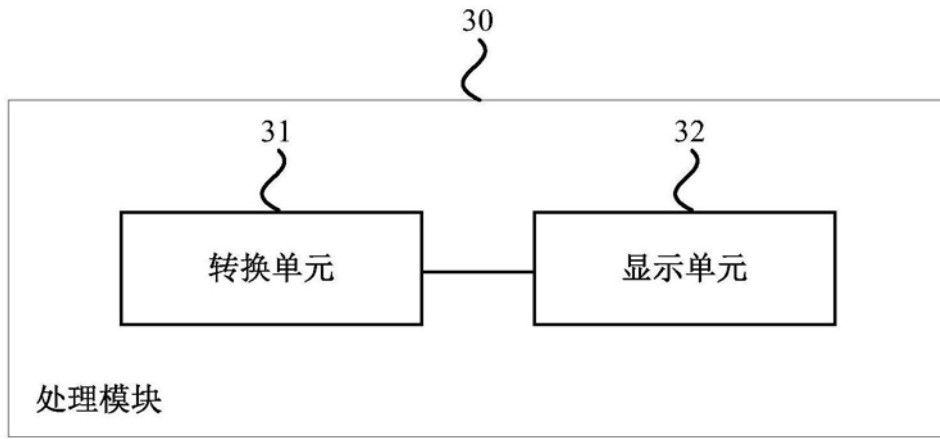


图5

专利名称(译)	一种显示面板检测方法及其装置		
公开(公告)号	CN107680522A	公开(公告)日	2018-02-09
申请号	CN2017110929743.0	申请日	2017-09-30
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
[标]发明人	王丽蓉		
发明人	王丽蓉		
IPC分类号	G09G3/00		
CPC分类号	G09G3/006		
代理人(译)	胡艳华 李丹		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明实施例提供一种显示面板检测方法及其装置，其中，该显示面板检测方法包括：向显示面板上的每个像素驱动电路的输入端输入测试信号；采集每个像素驱动电路的输出端输出的电压；根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压，形成用于检测显示面板Mura现象的图像，本发明的技术方案通过对每个像素驱动电路输入测试信号，根据每个像素驱动电路的输出端输出的电压，形成图像来检测显示面板Mura现象，能够检测未进行OLED器件制作的显示面板是否存在Mura现象，并将阈值电压漂移不均匀的显示面板排除，节约了制作成本。

